

## 超音波顕微鏡

材料のクラック・ボイドの画像化

### 【型式】

(株)日本レーザー SAMTEC EVOLUTION I

### 【仕様】

スキャンモード：A,B,C,D

測定範囲：最大 10×10cm

測定周波数：3.5,10,100MHz

### 【設置年度】

2010 年度（平成 22 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日